01;07 К динамической теории фокусирующего спектрометра Кошуа

© Т. Чен

Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, 119571 Москва, Россия e-mail: docent65@mtu-net.ru, physicist@rambler.ru

(Поступило в Редакцию 10 октября 2006 г.)

Представлена динамическая теория Лауэ-дифракции рентгеновской волны на совершенном изогнутом кристалле в схеме Кошуа. Рассмотрены случаи сферически расходящейся и сходящейся волн. Получены оценки спектрального разрешения фокусирующего спектрометра по Кошуа.

PACS: 41.50.+h, 78.70.Ck, 07.85.Nc

Наиболее известной схемой фокусировки рентгеновского излучения при его Лауэ-дифракции на изогнутом кристалле является схема, предложенная в 1930-х гг. И. Кошуа [1–3]. Первый в СССР кристалл-дифракционный фокусирующий спектрометр Кошуа был создан в 1950-х гг. [4]. Спектрометр по Кошуа часто использовался в экспериментальных и теоретических работах по рентгено- и гамма-спектральному анализу [5–23]. В ряде работ предложена комбинированная схема Кошуа–Иоганссона [15–18].

При этом в большинстве теоретических исследований дифракция рентгеновских лучей в изогнутом кристалле рассматривалась лишь кинематически. Автору настоящей работы известны лишь две статьи [8,9], в которых рассматривалась динамическая дифракция рентгеновского излучения в схеме Кошуа.



Геометрия Лауэ-дифракции сферической волны на изогнутом кристалле. $\mathbf{k}_{0,h}$ — волновые вектора падающей и дифрагированной волн, соответствующие точному брэгговскому условию, $\mathbf{k}_h = \mathbf{k}_0 + \mathbf{h}$, \mathbf{h} — вектор обратной решетки идеального кристалла, S — точечный источник рентгеновского излучения, P — точка наблюдения.

Целью настоящей статьи является дальнейшее развитие теории динамической дифракции рентгеновской волны в схеме Кошуа. За основу берется теория лауэдифракции рентгеновского излучения в изогнутых совершенных кристаллах, построенная в работах Ф.Н. Чуховского с соавторами [8,24,25].

Рассмотрим изогнутый совершенный кристалл, обращенный выпуклой стороной к протяженному источнику рентгеновского излучения (см. рисунок). Пусть из точечного источника *S*, входящего в состав протяженного источника, исходит сферическая волна.

Вычислим поле дифрагированной волны на выходной поверхности изогнутого кристалла. Согласно динамической теории Лауэ-дифракции рентгеновских лучей на изогнутом кристалле [24,25], амплитуда дифрагированной волны на выходной поверхности кристалла имеет следующий вид:

$$E_{h}(\mathbf{r}_{T}) = \exp\left[iq_{0}x_{T} + i4^{-1}a^{-1}\varkappa\chi_{0}t(\gamma_{0}^{-1}a_{h} + \gamma_{h}^{-1}a_{0}) + 2^{-1}iR^{-1}\varkappa\gamma_{h}(x_{T} - a_{h}t)^{2} - 4ia^{2}Bt^{2} + i\pi/2 + i\varkappa L_{0}\right]$$

$$\times L_{0}^{-1}\sigma_{h}\int_{-\infty}^{+\infty} dx \exp(-i\varkappa\gamma_{0}\Delta\theta x) \exp\left[i\varkappa(\gamma_{0}^{2}x^{2} + y^{2})/(2L_{0}) - i\varkappa y^{2}x \sin\varphi_{0}/(2L_{0}^{2}) - i2^{-1}R^{-1}\varkappa\gamma_{0}x^{2} - iq_{0}x\right](2\pi)^{-1}$$

$$\times \int_{-\infty}^{+\infty} dk \exp\left[-ik(x_{T} - x + a_{0}t)\right] \times G_{h}(k, t).$$
(1)

Здесь введены следующие обозначения: $q_0 = \varkappa \chi_0(\gamma_0^{-1} - \gamma_h^{-1})/(4a)$, $2a = a_0 - a_h$, $a_{0,h} = \operatorname{tg} \varphi_{0,h}$, $\sigma_h = C\varkappa \chi_h \gamma_0/(2\sin 2\theta_B)$, $\mathbf{r}_T = (x_T, y_T)$, R — радиус изгиба кристалла, L_0 — расстояние от точечного источника до центра кристалла, $\varkappa = 2\pi/\lambda$, λ — длина волны падающего излучения, γ_0 и γ_h — направляющие косинусы для волновых векторов падающего и отраженного излучений, $\varphi_{0,h} = \operatorname{arcos} \gamma_{0,h}$, θ_B — брэгговский угол, $\Delta \theta = \widetilde{\varphi}_0 - \varphi_0$, χ_0 и χ_h — фурье-компоненты рентгеновской поляризуемости, C —

поляризационный фактор, t — толщина кристалла, $G_h(k, t)$ — фурье-компонента функции Грина для изогнутого совершенного кристалла, B — градиент деформации.

В дальнейшем мы будем рассматривать кристалл, отражающие плоскости которого совпадают с нормальными поперечными сечениями и располагаются веерообразно, т.е. градиент деформации B = 0 [8].

Согласно рентгено-оптическому принципу Гюйгенса—Френеля, дифрагированная волна в вакууме на расстоянии L_h от кристалла является сверткой дифрагированной волны $E_h(\mathbf{r}_T)$ на выходной поверхности кристалла с функцией Грина в вакууме $G_0(\mathbf{r})$:

$$E_{h}(\mathbf{r}_{P}) \exp[i\mathbf{k}_{h}\mathbf{r}_{P}] = 2 \exp(-i\pi/2)\varkappa\gamma_{h}$$

$$\times \int d^{2}\mathbf{r}_{T}E_{h}(\mathbf{r}_{T}) \exp[i\mathbf{k}_{h}\mathbf{r}_{T}]G_{0}(\mathbf{r}_{P}-\mathbf{r}_{T}),$$

$$G_{0}(\mathbf{r}) = \exp(i\varkappa r)/(4\pi r).$$
(2)

В рамках параболического приближения разложим функцию $G_0(\mathbf{r}_P - \mathbf{r}_T)$, ограничившись в фазе квадратичными по координатам слагаемыми

$$G_0(\mathbf{r}_P - \mathbf{r}_T) \cong (4\pi L_h)^{-1} \exp(i\varkappa L_h) \exp\left[-i\varkappa x_T \sin\varphi_h + i(2L_h)^{-1}\varkappa \left(\gamma_h^2 \{x_P - x_T - L_h \sin\varphi_h\}^2 + \{y_P - y_T\}^2\right) \times \left\{1 - \sin\varphi_h (x_P - x_T - L_h \sin\varphi_h)/L_h\right\}\right].$$
(3)

Тогда амплитуда дифрагированной волны в вакууме равна

$$E_{h}(\mathbf{r}_{P}) \exp[i\mathbf{k}_{h}\mathbf{r}_{P}] = 2(2\pi)^{-1} \exp(-i\pi/2)\varkappa\gamma_{h}$$

$$\times \exp\{i4^{-1}a^{-1}\varkappa\chi_{0}t(\gamma_{0}^{-1}a_{h}+\gamma_{h}^{-1}a_{0})+i\varkappa L_{0}\}L_{0}^{-1}\sigma_{h}$$

$$\times \int dx_{T} \exp\{iq_{0}x_{T}-ikx_{T}+2^{-1}iR^{-1}\varkappa\gamma_{h}(x_{T}-a_{h}t)^{2}$$

$$+2^{-1}iL_{h}^{-1}\varkappa\gamma_{h}^{2}x_{T}^{2}-iL_{h}^{-1}\varkappa\gamma_{h}^{2}x_{P}x_{T}+i\varkappa\gamma_{h}^{2}x_{T}\sin\varphi_{h}\}$$

$$\times \int_{-\infty}^{+\infty} dk \exp[-ik(x+a_{0}t)] \times G_{h}(k,t). \qquad (4)$$

При $L_h = -R\gamma_h$, что соответствует схеме Кошуа со сферически расходящейся волной, падающей на выпуклый кристалл, в интеграле по x_T пропадают квадратичные члены. В этом случае при бесконечных пределах интегрирования интеграл по x_T сводится к δ -функции, и интеграл по k немедленно вычисляется, приводя к результату, полученному в [8].

Рассмотрим теперь симметричную дифракцию, когда $\gamma_0 = \gamma_h = \cos \theta_B$. Кроме того, пусть $L_h = -R \cos \theta_B = -L_0$, где $L_0 < 0$, что соответствует расположению

мнимого источника на круге Роуланда. Тогда интеграл по x в (1) сводится к δ -функции, а интеграл по k равен

$$G_h(q_0 + \varkappa \gamma_0 \Delta \theta) \exp[-i(q_0 + \varkappa \gamma_0 \Delta \theta)(x_T + a_0 t)].$$
(5)

Амплитуда дифрагированной волны в вакууме равна

$$E_{h}(\mathbf{r}_{P}) \exp[i\mathbf{k}_{h}\mathbf{r}_{P}] = 2(2\pi)^{-1} \exp(-i\pi/2)\varkappa\gamma_{h}$$

$$\times \exp\{i4^{-1}a^{-1}\varkappa\chi_{0}t(\gamma_{0}^{-1}a_{h}+\gamma_{h}^{-1}a_{0})+i\varkappa L_{0}$$

$$-iq_{0}a_{0}t-i\varkappa\gamma_{0}\Delta\theta a_{0}t+2^{-1}iR^{-1}\varkappa\gamma_{h}a_{h}^{2}t^{2}\}L_{0}^{-1}\sigma_{h}$$

$$\times G_{h}(q_{0}+\varkappa\gamma_{0}\Delta\theta)\int dx_{T}\exp\{-i\varkappa\gamma_{0}\Delta\theta x_{T}$$

$$-iR^{-1}\varkappa\gamma_{h}x_{T}a_{h}t-iL_{h}^{-1}\varkappa\gamma_{h}^{2}x_{P}x_{T}+i\varkappa\gamma_{h}^{2}x_{T}\sin\varphi_{h}\}.$$
 (6)

Выражение (6) дает амплитуду волны в схеме Кошуа при падении на кристалл сферически сходящейся волны. Фокусом является мнимый фокус, расположенный на круге Роуланда. В работе [8] рассматривался лишь случай расходящейся волны, но было отмечено, что более резкая фокусировка должна получаться при падении на кристалл сходящейся волны.

В рамках параболического приближения для фазы падающей и дифрагированной волн интеграл по x_T в (6) должен вычисляться с конечными пределами интегрирования: $-x_{\text{eff}} \le x_T \le x_{\text{eff}}$. Результатом интегрирования является функция $2\sin(Ax_{\text{eff}})/A$, где $A = -L_h^{-1}\varkappa \gamma_h^2 x_P - \varkappa \gamma_0 \Delta \theta - R^{-1} \varkappa \gamma_h a_h t + \varkappa \gamma_h^2 \sin \varphi_h$. Заметим, что главный максимум смещен относительно точки геометрического фокуса $x_P = 0$. Кроме того, видно, что при фокусировке сходящейся волны распределение интенсивности вблизи фокуса оказывается зависящим от положения произвольного точечного источника, входящего в состав протяженного источника.

Полагая аргумент синуса в функции распределения интенсивности равным π , находим дифракционное уширение фокуса $\Delta x_{P,F}$:

$$\Delta x_{P,F} = \pi L_h / (\varkappa \gamma_h^2 x_{\text{eff}}). \tag{7}$$

Для симметричного (220)-отражения Си K_{α} -излучения от кристалла кремния, изогнутого с радиусом R = 1 m, и при $x_{\rm eff} = 10^{-2}$ m получим $\Delta x_{P,F} \sim 10^{-8}$ m.

Спектральное разрешение фокусирующего спектрометра Кошуа равно

$$\Delta \lambda / \lambda = -\operatorname{ctg} \theta_B (\Delta \theta)_F, \ (\Delta \theta)_F = \Delta x_{P,F} \gamma_h / L_h.$$
(8)

Теоретическая оценка на основе (8) дает $\Delta\lambda/\lambda \sim 10^{-8}$. Учитывая протяженность источника в схеме Кошуа, следует вместо $\Delta x_{P,F}$ подставить в (8) размер *l* источника. Тогда получим более реальную оценку для спектрального разршения. Например, при $l \cong 10^{-3}$ m имеем $\Delta\lambda/\lambda \sim 10^{-3}$, что согласуется с экспериментальными данными [14].

Список литературы

- [1] Cauchois Y. // J. Phys. Rad. 1932. Vol. 3. P. 320–336.
- [2] Cauchois Y. // Comp. Rend. Acad. Sci. IIB. 1932. Vol. 194.
 P. 362–365.
- [3] Cauchois Y. // Ann. Phys. 1934. Vol. 1. P. 215-266.
- [4] Лукирский П.И., Сумбаев О.И. // Изв. АН СССР. Сер. Физ. 1956. Т. 20. С. 903.
- [5] Kazi A.H., Rasmussen N.C., Mark H. // Rev. Sci. Instr. 1960.
 Vol. 31. P. 983–987.
- [6] Sumbaev O.I., Smirnov A.I. // Nucl. Instr. and Meth. 1963. Vol. 22. P. 125–137.
- [7] Тюнис А.В., Самсонов В.М., Сумбаев О.И. Кристаллдифракционный спектрометр для измерения химических смещений рентгеновских линий *L*-серии актинидов. Препринт ЛИЯФ-151. Л., 1975. 16 с.
- [8] Габриелян К.Т., Чуховский Ф.Н., Пинскер З.Г. // ЖТФ. 1980. Т. 50. Вып. 8. С. 1641–1646.
- [9] Сумбаев О.И., Лапин Е.Г. // ЖЭТФ. 1980. Т. 78. Вып. 2. С. 802–812.
- [10] Григорьев Б.В., Иванов Ю.М., Денисов А.С. и др. Кристалл-дифракционный спектрометр по Кошуа для изучения рентгеновского излучения пионных атомов на синхроциклотроне ЛИЯФ. Препринт ЛИЯФ-1232. Л., 1986. 50 с.
- [11] André J.M., Kefi M., Avila A., Couillaux P., Bonnelle C. // Rev. Sci. Instr. 1987. Vol. 58. P. 374–378.
- [12] Verman B.S., Serikov I.V. // X-Ray Spectrometry. 1990.
 Vol. 19. Iss. 3. P. 129–132.
- [13] Deshpande S.D., Moghe N.V., Sapre V.B., Mande C. // Meas. Sci. Technol. 1990. Vol. 1. P. 1250–1253.
- [14] Badura E., Besch H.J., Beyer H.F. et al. // Scientific report JB-Tech-97. 1997.
- [15] Baronova E.O., Stepanenko M.M. // Nukleonika. 2001. Vol. 46. P. S53–S56.
- [16] Baronova E.O., Stepanenko M.M., Lider V.V., Pereira N.R. // Proc. Workshop on Curved Crystals. Weimar, Germany, 1964.
- [17] Баронова Е.О., Степаненко М.М. // Прикладная физика. 2001. № 2. С. 106–111.
- [18] Baronova E.O., Stepanenko M.M., Pereira N.R. // Rev. Sci. Instr. 2001. Vol. 72 (2). P. 1416–1420.
- [19] Hiraoka N., Itou M., Ohata T., Mizumaki M., Sakurai Y., Sakai N. // J. Synchr. Rad. 2001. Vol. 8. P. 26–32.
- [20] Alexeev V.L., Rumiantsev V.L. // Proc. 11th Int. Symp. on Capture Gamma-Ray Spectroscopy and Related Topics / Ed. by J. Kvasil, P. Sejnar, M. Krticka. World Scientific. 2003. P. 625–628.
- [21] Alexeev V.L., Rumiantsev V.L. Modernization of the Crystal Diffraction Gamma-Spectrometer GSK-2. Preprint PNPI-2523. Gatchina, 2003. P. 25.
- [22] Алексеев В.Л., Румянцев В.Л. // Изв. РАН. Сер. Физ. 2004. Т. 68. № 8. С. 1080.
- [23] Алексеев В.Л., Румянцев В.Л., Федоров В.В. Измерения гамма-спектра активной зоны реактора на кристаллдифракционном гамма-спектрометре ГСК-2М. Препринт ПИЯФ-2605. Гатчина, 2005. 35 с.
- [24] Chukhovskii F.N., Petrashen' P.V. // Acta Cryst. 1977. Vol. A33. P. 311–319.
- [25] Чуховский Ф.Н. // Металлофизика. 1980. Т. 2. № 6. С. 3–28.